

Specyfikacja techniczna do zakupu inwestycyjnego defektoskopu do badania NDT kompozytów:

Ze względu na metodykę badań materiałów kompozytowych opracowaną przez podmiot zewnętrzny dla potrzeb naszego projektu BSP preferuje się następujący defektoskop wymieniony w wspomnianym dokumencie:

Defektoskop: BondMaster 600m (Multi-mode), zasilanie 230V, menu w j. polskim i angielskim.

Wyposażenie:

Sondy do wykonywania badań nieniszczących w trzech technikach:

Sondy Pitch-Catch

- S-PC-P14 9323945 P/C PROBE : Broad Band Frequency Pitch-Catch Probe with 4 feet, Spring Loaded Tips with 15 mm (0.60) Spacing, High Voltage, PowerLink
- SPO-5629PHV 9322184 P/C PROBE : Broad Band Frequency Pitch-Catch Probe, Spring Loaded Tips with 12.7 mm (0.5) Spacing, High Voltage
- SPO-5629-H-R1 BONDMASTER PROBE. Fixture/ Holder for Sonic BondMaster probe "SPO-5629" series, "friction fit" locking mechanism.

Sondy Resonance:

- S-PR-2 9317810 RESONANCE PROBE : 65 KHz Resonance Probe, 15.9 mm (0.63) Case Diameter
- S-PR-3 9317793 RESONANCE PROBE : 110 KHz Resonance Probe, 15.9 mm (0.63) Case Diameter
- S-PR-4 9317794 RESONANCE PROBE : 165 KHz Resonance Probe, 12.7 mm (0.50) Case Diameter
- S-PR-5 9317795 RESONANCE PROBE : 250 KHz Resonance Probe, 9,5 mm (0.37) Case Diameter
- S-PR-1 9317809 RESONANCE PROBE : 35 KHz Resonance Probe, 15.9 mm (0.63) Case Diameter
- S-PR-6 9317811 RESONANCE PROBE : 330 KHz Resonance Probe, 9.5 mm (0.37) Case Diameter

Sondy Mechanical Impedance Analysis (MIA):

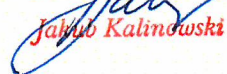
- S-MP-3 9317796 MIA PROBE : Right Angle MIA Probe, Standard 12.7 mm (0.5) Tip Diameter, Requires BMM-H (U8770417) for Spring Loading
- S-MP-4 9317808 MIA PROBE : Right Angle MIA Probe, Small 6.35 mm (0.25) Tip Diameter, Requires BMM-H (U8770417) for Spring Loading
- BMM-H SPRING HOUSING ASSEMBLY : Spring Housing Assembly For S-MP-3(U8010011), S-MP-3L (U8770345), S-MP-4 (U8010015) and S-MP-4L (U8770338) MIA probes

Dostarczony defektoskop musi być wyposażony w niezbędne przewody do podłączenia wymaganych sond, instrukcję obsługi, świadectwo/certyfikat wzorcowania dla defektoskopu oraz sond.
Gwarancję producenta na działanie wszystkich wymienionych sond i defektoskopu.

Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia i wystawienia niezbędnego zaświadczenia z tego szkolenia.

Odpowiedzialny 3-go stopnia w
badaniach nieniszczących

PT-3, MT-3, ET-2
EN 4179/NAS 410


Jakub Kalinowski